

HAXPES：硬X線光電子分光法

2026

1/29

THU

研修会の概要

- 開催日等：令和8年1月29(木) @NanoTerasu
11:00/12:30/14:00/15:30 のいずれか開始で、各者1時間30分
- 講師：株式会社日産アーク
- 測定手法：HAXPES（硬X線光電子分光法）
※ 参考 [X線光電子分光分析法（XPS）による表面分析をわかりやすく解説（株式会社日産アーク）](#)
- 使用するビームライン：BL09U
- 研修内容：自社で測定したいサンプルをご提供いただき、当日NanoTerasuで測定します。
当日はNanoTerasuでの測定作業に関するご説明と簡単な解析・説明を行い、
後日オンラインで講師と個別面談のうえ、測定計画書（指定様式）をご提出いただきます。

参加申込

- 対象者：仙台市の [NanoTerasuシェアリング2000](#) の利用を検討中または希望する事業者
※ コアリションメンバー除く
- 定員：4者（1者あたり4名まで参加可）
- 応募方法：12月12日(金)までに、下記または右のコードよりご応募ください。

応募フォーム <https://logoform.jp/form/3PrJ/1247575>



※ 応募者多数の場合は募集締切後に抽選を行い、後日結果をお知らせします。

留意事項

- 当日は 自社で測定したい試料とデータ持ち帰り用のストレージ* をお持ちください。
* 可能であれば新品をご用意ください。使用中のものは事前にウイルスチェックを行ってください。
- 試料の測定は順番で行いますので、開始時間が前後する可能性があります。
- 測定試料は以下のものをご準備ください。※ 各社2検体程度 を想定
 - ・ 10mm角×厚さ1mm以下の板状固体 ※粉末でも可（測定前にカーボンテープによるホルダ固定を行います）
 - ・ できるだけ導電性のあるもの（低い場合は事前にご連絡ください）
 - ・ 真空引きできるもの（超高真空中(10^{-7} Pa以下)で固体として安定に存在できるもの。揮発しやすい液体や不安定な試料（高蒸気圧、脱ガス、潮解性など）は測定できません）
 - ・ 表面汚染のないもの（基本的に表面分析のため、測定したい箇所に汚れなど評価対象外の物質が多量に残っている場合は測定できません。可能であれば洗浄除去をお願いいたします）
 - ・ 測定現場で加工しても良いもの
 - ・ 安全上/法規上問題ないもの（毒劇物などは要相談）、他の参加者に見られても問題ないもの
→ 事前にご相談いただければ、講師より測定可否をご回答します。
- その他
 - ・ 試料の詳細情報*（組成や形状等）は安全管理審査に使用しますので、事前にご教示いただきます。
* 組成情報はすべてを開示していただく必要はなく、微量成分・秘匿としたい成分は曖昧でも構いません。
 - ・ 研修会への参加費用は無料ですが、旅費や測定試料の準備費用等をご負担ください。
 - ・ 当日はメディアの取材が入る可能性があります。
 - ・ 参加にあたりご提供いただいた情報は、本研修会の実施のため講師及び施設と共有します。
また、本市制度のご案内に使用させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。